•研究论文•

H 原子在 W 低指数面上的吸附位和吸附态

张静", 一于艳杰" 王泽新*,"秦伟娜" 刁兆玉" 郝策"

(*山东师范大学化学系 济南 250014) (*太原科技大学化学与生物工程学院 太原 030012) (*大连理工大学精细化工国家重点实验室 大连 116024) (^d山东师范大学管理学院 济南 250014)

摘要 应用原子和表面簇合物相互作用的 5 参数 Morse 势及由 5 参数 Morse 势组装推广的 LEPS 方法对 H-W 低指数 表面吸附体系进行了研究,并获得了全部临界点特性. 计算结果表明,低覆盖度下,H 原子优先吸附在 W(100)面的内层 吸附位二层桥位 B',获得 156 meV 的垂直振动频率,随着覆盖度的增加,H 原子稳定吸附在表层的五重洞位(二层项位)、桥位及顶位. 内层吸附位的优先吸附,对与其邻近的表面吸附位的临界点性质有一定影响. 在 W(110)面上只存在三重 洞位的稳定吸附态,垂直振动频率为 151 meV. 在 W(111)面上存在三种稳定吸附态,子表面吸附位 H₁,桥位 B'和顶位 T,分别获得 104, 200, 259 meV 的垂直振动频率. 在低覆盖度下,H 原子优先吸附在子表面吸附位 H₁. **关键词** H-W 表面吸附体系: 内层吸附: 5-MP: LEPS 势

Adsorption Sites and States for H Atom on W Low-index Surfaces

ZHANG, Jing^{*a,b*} YU, Yan-Jie^{*c*} WANG, Ze-Xin^{*,*a*} QIN, Wei-Na^{*d*} DIAO, Zhao-Yu^{*a*} HAO, Ce^{*c*}

(^a Department of Chemistry, Shandong Normal University, Jinan 250014) (^b School of Chemical and Biological Engineering, Taiyuan Science and Technology University, Taiyuan 030012) (^c State Key Laboratory of Fine Chemicals, Dalian University of Technology, Dalian 116024) (^d School of Management, Shandong Normal University, Jinan 250014)

Abstract The adsorption of H atom on W low index surfaces was investigated with the 5-parameter Morse potential (5-MP) and the extended LEPS (constructed by 5-MP). All critical characteristics of this system were obtained. The calculated results show that H atom preoccupies the twofold bridge site of the subsurface on the intact W(100) surface at low coverage, and obtains the perpendicular vibration frequency of 156 meV. The H-atom adsorption on bridge site, top site and fivefold hollow site (the top site on the second W layer) were observed at high coverage. The preoccupancy of the subsurface adsorption site affects the critical characteristics of the adsorption sites adjacent to the subsurface adsorption site. On (110) surface H atom occupies the three-fold hollow site and produces the vibration frequency of 151 meV. On (111) surface there exist three stable adsorption states, the subsurface adsorption site H₁, the bridge sites and top sites, with the eigenvibration of 104, 200 and 259 meV, respectively. H atom preoccupies the H₁ site at low coverage. **Keywords** H-W surface adsorption system; subsurface adsorption; 5-MP; LEPS

* E-mail: wangzexin@sdnu.edu.cn Received April 25, 2006; revised September 18, 2006; accepted December 18, 2006. 山东省自然科学基金(No. Y2002B09)资助项目. H 原子在过渡金属表面的吸附是表面科学研究中的一大热点.其原因不仅在于它在催化反应中的重要性,也因为 H 原子是最简单的一种被吸附物.人们已经采用各种实验及理论方法对 H-W 体系进行了很长时间的研究,但在吸附态临界点性质如吸附位等的确定上仍然存在着争议.

关于 H-W(100)表面吸附体系, Froitzhein 等^[1]的电 子能量损失谱(EELS)实验结果推测,在低覆盖度下,H 原子吸附在顶位,垂直振动频率为 130 meV;随着覆盖 度的增加, H 原子会吸附在桥位, 相应的垂直振动频率 为 150 meV. Adnot 等^[2]的 EELS 结果支持了这一结论. 但Tamm等^[3]的计算结果显示H原子吸附在顶位的结合 能为 2.94 eV, 大于在桥位的结合能 2.81 eV. Branes 等^[4] 也用 EELS 方法研究了 H 原子在 W(100)面上的振动模 式,结果认为H原子在W(100)面上的吸附引起了W表 面的重构, 形成($\sqrt{2} \times \sqrt{2}$)的结构, 但 H 原子始终吸附 在W(100)面的桥位, 与覆盖度的高低没有关系. 文中振 动频率与覆盖度关系图显示: 在低覆盖度下, 对称谱图 中有峰值分别为155,125,250 meV的3个峰,其中最强 峰为155 meV 的峰, 250 meV 的峰最弱, 在反对称谱图 中出现了4个峰,峰值分别为155,120,55,250 meV.随 着覆盖度增加,到0.3 L时对称谱图中只出现了一个峰, 峰值为 130 meV, 反对称谱图中仍有 4 个峰, 分别为 250, 160, 130, 80 meV. Branes 等^[4]将这些峰解释为氢原 子吸附在桥位所产生的振动,低覆盖度下相应的垂直振 动频率为 155 meV, 两平行振动频率为 55 和 125 meV. 随着覆盖度的增加, 垂直振动频率减少为 130 meV, 平 行振动频率增加为 80 和 160 meV. Didham 等^[5]得到的 EELS 图谱与 Branes 等^[4]的结果非常一致,并且也推测 H 原子吸附在 W(100)面的桥位, 在低覆盖度下形成一 $(\sqrt{2} \times \sqrt{2})$ 结构,相应的垂直振动频率是 155 meV,随 着覆盖度增加,相应的垂直振动频率是130 meV. 饱和 (1×1)H 结构的 EELS^[6]研究也认为 H 原子吸附在桥位, 相应的垂直振动频率为 130 meV, 两平行振动频率为 80, 160 meV. 在 Woods 等^[7]的 EELS 谱图中不仅出现了 130, 80, 160 meV, 还出现了一个新的频率 118 meV, Woods 等推测其原因是两个氢原子同时吸附在钨上, 可 以形成 6 个吸附振动模式, 118 meV 是其中的一个, 并 将其指派为垂直振动频率. Jaeger 等^[8]结合 LEED 和 ESD 方法对 c(2×2)结构的 H-W(100)体系进行了研究, 认为 氢原子吸附在重构表面的桥位,且吸附高度为 0.137 nm, 吸附键长为 0.195 nm. King 等^[9]的 LEED 也预测了 同样的稳定吸附位. Nordlander^[10]通过有效介质理论计 算研究了H原子在未重构的W(100)面上的吸附. 认为H 原子吸附在 W(100)表面的中心位置是最稳定的. 但由

于 H 原子在中心位置和桥位吸附的能量仅仅相差 80 meV,因此对于不稳定的钨(100)重构面上桥位稳定吸附是可能的.在中心位置发现了一个较低的振动频率在 90 meV,在桥位获得的振动频率为 127 meV.文中又通过理论计算得出了 H-W 吸附键长为 0.179 nm.

对 H-W(110)表面吸附体系的研究已经有很长的时 间了,人们采用各种各样的方法比如表面反射光谱法 (surface reflectance spectroscopy, SRS)^[11], (angle resolved photoemission)^[12],低能电子衍射(LEED)^[13~15],电子能量 损失谱(EELS)^[16,17], 经典轨道理论(CTS)^[18,19], 密度泛函 理论(DFT)^[15],从头算理论^[20]以及有效介质理论^[10]等. SRS^[11]结果认为最稳定的吸附位是桥位. Blanchet 等^[12] 的实验结果也认为 H 原子稳定吸附在桥位. 但 Backx 等^[21]报道了氢吸附在钨(110)和(111)面的顶位,且垂直 振动频率分别为1291 和1267 cm⁻¹, 另外还在110 面上 发现了767 cm⁻¹的峰, 他们将其指派为氢吸附在桥位的 垂直振动频率. 但更多的实验及理论结果认为H原子在 W(110)面上最稳定的吸附位是三重位. Nordlander 等^[10] 的有效介质理论就得到了 H 原子吸附在三重位的结论, 同时指出从三重位到长桥位的势垒很低, H 原子很容易 通过长桥位在两个相邻的三重位间扩散. Herlt 等^[13]的 LEED 结果推测 H 原子吸附在 W(110)表面的三重位,并 且吸附高度为 0.125 nm, 吸附键长为 0.209 nm. Chung 等^[14]报道了 H/W(110)表面的新的 LEED 数据,显示出 在 0.5 ML 的覆盖度下, 氢的吸附诱使 W(110)表面发生 了重构,即顶层的钨原子相对于大多数来说有一个横向 的移动(沿着[110]方向), 且氢原子吸附在三重洞位. 但 Arnold 等^[15]结合 LEED 和 DFT 方法也研究了这一体系, 认为氢原子吸附在钨(110)面上不发生重构. LEED 结 果^[15]认为 H 原子的稳定吸附位在三重洞位及其附近, 吸 附高度为(0.120±0.005) nm. DFT 结果^[15]推测的吸附位为 从三重位向顶位稍微移动 0.01 nm. 同时计算得吸附高度 为0.112 nm. Balden 等^[16]用 EELS 方法研究了三个覆盖度 下H原子在W(110)面上的振动模式,结果显示在覆盖度 低于 0.75 ML 时, 可以形成(2×1)和(2×2)结构, 谱图显 示H原子吸附在低对称位,如长桥位与短桥位之间的三 重位. 当覆盖度大于 0.75 ML 时, 形成(1×1)结构, Balden 等^[16]认为 H 原子处于一个高度混乱的二维流体状 态. 当覆盖度为0.5 ML时, EEL 谱图中有三个损失峰, 分 别为 546, 768, 1252 cm⁻¹, 但到目前还没有明确的实验或 理论依据来辨别哪个峰对应着垂直表面的振动. Balden 等^[16]比较同意将最大的振动频率即 1252 cm⁻¹ 解释为垂 直表面振动. 1996 年 Balden 等^[17]再一次用 EELS 方法研 究了这一体系,认为H原子在W(110)面上没有引起表面 重构,在覆盖度小于 0.75 ML 时, H 原子稳定吸附在三重 位,对应的垂直振动频率为 1252 cm⁻¹. Altshuler 等^[18,19] 先后两次用经典轨道理论(CTC)研究了 H-W(110)体系. 他们提出了两种势能模型,一种是低势垒模型,另一种 是高势垒模型. 通过与实验结果相比较, Altshuler 等^[18,19] 认为高势垒模型是合理的模型.即 H 原子吸附在三重 位,短桥位的势垒为 0.25 eV,长桥位的势垒为 0.05 eV. 垂直振动频率为1241 cm⁻¹,两平行振动频率为 872,651 cm⁻¹. Kohler 等^[20]利用从头算的方法计算得出 H 原子的 稳定吸附位为三重位,且计算出吸附高度为 0.112 nm(五层), 0.111 nm(七层), 0.109 nm(九层).

对 H-W(111)表面吸附体系的实验和理论研究比较 匮乏. 在七十年代 Tamm 等^[22,23]先后两次实验研究了氢 分子在 W 三个低指数面上的吸附及脱附. 从氢分子在 W(111)面上的脱附谱图来看,存在四个不同的原子脱 附峰,即存在四种不同的稳定吸附位,但文中没有明确 指出是哪四种吸附位. Madey 等^[24]的实验结果也得到了 与Tamm等^[22,23]相同的结论,认为氢分子在W(111)面上 的吸附是化学吸附,脱附谱图显示存在 4 种不同的原子 吸附态.

虽然人们对 H-W 表面吸附体系进行了大量的实验 研究, 但是由于实验条件的不同, 只能得到表面吸附微 观动力学的片段信息. 尤其对于 H-W(100)表面吸附体 系,无论是实验还是理论对表面吸附态,吸附位,表面 振动等动力学信息的分析,十分混乱.因此,可信的系 统理论处理势在必行.本文给出了吸附原子和金属表面 相互作用的5参数Morse 势方法(简称5-MP). 该方法通 过拟合实验探针获得的吸附原子和表面相互作用的片 段信息,优化一组参数,就可以获得吸附原子在表面上 的全部临界点特性,这样人们就可以获得 H 在 W 表面 吸附的全面的了解. 5-MP 势的特点是具有和簇合物表 面结构无关的特性.也就是说,解析的 5-MP 不仅适用 于低指数表面吸附体系,而且适用于由低指数面构成的 台阶面(或高指数面)吸附体系. 该方法已经成功地处理 了 H-Ni^[25], Cl-Ag^[26], H-Ru^[27], H-Cu^[28], H-Fe^[29]等表面吸 附体系,获得了非常好的结果.本文将构造H-W表面吸 附体系的 5-MP, 系统地研究 H-W 低指数面吸附体系的 微观动力学性质.

1 计算方法和表面簇合物模型

1.1 吸附原子和表面相互作用体系的 5-MP 势

文献[25~29]对 5-MP 势作了详尽的描述,本文简述如下. 假设表面簇合物冻结,坐标为 *R* 的吸附原子与表面簇合物相互作用的 5 参数 Morse 势(5-MP 势)可表示为

$$U(\mathbf{R}) = D \sum_{i=1}^{\text{Cluster}} (\frac{h_i + Q_1}{R_i + Q_2}) \{ \exp[-2\beta(R_i - R_0)] - 2\exp[-\beta(R_i - R_0)] \}$$
(1)

上式求和遍及整个表面簇合物(Cluster)的原子.其中, D是结合能参数, $\beta 和 R_0$ 为振动和平衡距离参数, $Q_1 和 Q_2$ 为能量均分参数, R_i 为吸附原子和表面簇合物中第 i 原 子之间的距离, h_i 为吸附原子在第i个表面簇合物原子所 在平面上的法线距离. 5-MP 势 $U(\mathbf{R})$ 只有 5 个可调参数, 为 $D, \beta, R_0, Q_1 和 Q_2$.

1.2 用 5-MP 势组装推广的 LEPS 势

5-MP 势(1)正可以看作是原子和表面簇合物之间相 互作用的成键对势.由此可得反键对势:

$$U^{+}(\mathbf{R}) = D^{+} \sum_{i=1}^{\text{Cluster}} \left(\frac{h_{i} + Q_{1}}{R_{i} + Q_{2}}\right) \{\exp[-2\beta(R_{i} - R_{0})] + 2\exp[-\beta(R_{i} - R_{0})]\}$$
(2)

其中,结合能 $D^+=0.5D\frac{(1-\Delta)}{(1+\Delta)}$, Δ 为 Sato 参数. 通过

 $U(\mathbf{R})$ (1)和 $U^+(\mathbf{R})$ (2)进而获得库仑积分 $J = (U+U^+)/2$ 和 交换积分 $K = (U-U^+)/2$,从而获得推广的LEPS 势为

$$E = J_{AB} + J_{AM} + J_{BM} + [K_{AB}^2 + (K_{AM} + K_{BM})^2 - K_{AB}(K_{AM} + K_{BM})]^{\frac{1}{2}}$$
(3)

其中, J_{AB} 和 K_{AB} 为双原子分子的库仑积分和交换积分, J_{iM} 和 K_{M} 是原子与表面簇合物的库仑积分和交换积分 (*i*=A, B). 对于 2H-W(100)表面相互作用体系中(H=A, B), 势函数 *E* 中有两个需要调节的 Sato 参数, Δ_{H-W} 和 Δ_{H-H} . 本文用三个主要的解理面(100), (111), (110)拟合 一组 Sato 参数, 显然, 这样构造的推广的 LEPS 势, 具 有与表面簇合物结构无关的特性.

1.3 表面簇合物模型

金属钨为 BCC 晶格, 晶格常数 *a*₀=0.31583 nm. 图 1 给出了三个低指数面(100), (111)和(110)表面簇合物模型示意图,同时标注了原子在表面晶胞上的各个不等价吸附位.在(100)面上,T代表顶位,B代表桥位,H代表洞位,还有一个内层吸附位,位于第二层的桥位用 B'代表,为了更清楚地显示这个吸附位,我们删去了二层桥位之上的两个一层 W 原子(见图 1, 2).在(110)面上,分别用 H₃, LB, SB, T 来表示三重位、长桥位、短桥位及顶位吸附位.

(111)面上 T 仍是表示顶位, H₂表示二层三重洞位, H₃表示三层三重洞位, H₃'表示赝式三重位, B'表示近桥 位, 用H₁来表示子表面吸附位, 为了更清楚地显示这个 吸附位, 我们删去了表层的一个 W 原子(见图 1~3).



图 1 W(100), (110), (111)低指数面及吸附位示意图 Figure 1 Cluster models and adsorption sites of W(100), (110) and (111) surface



图 2 删去第一层两 W 原子的 W(100)面及吸附位示意图 **Figure 2** Cluster model and adsorption sites of W(100) surface without double W atoms on the first layer



图 3 删去第一层一个 W 原子的 W(111)面及吸附位示意图 **Figure 3** Cluster model and adsorption sites of W(111) surface without one W atom on the first layer

上述给出的 5-MP 势 *U*(*R*)具有 3 个自由度, 是个四 维势能超曲面. 对于势能超曲面上的变量, 一阶导数为 零的点, 通常称为势函数的临界点. 在临界点处的 2 阶 导数, 构成了力常数 Hessian 矩阵. 通常用 Hessian 矩阵

负本征值的个数 λ 来定义临界点的性质. 很明显, $\lambda=0$ 的临界点对应着原子的吸附态; λ=1 的临界点为势能超 曲面上的一级鞍点,对应着原子表面扩散的过渡态,这 是人们研究最多的两个态. 而 λ=2 的临界点为势能超 曲面上的局部极大点,通常为吸附原子表面扩散的峰 点. 本文就是用 λ 来确定临界点的性质. 计算通常取簇 合物表面层原子顶位为坐标的零点, x轴和 y轴分别对应 着图1所示的晶轴方向,z轴指向真空. 一般取表面相邻 两行(两列)原子的间距作为x和y轴的单位长度,这样定 义的坐标系简称为格子坐标.两个H原子在表面上运动 具有 6 个自由度. 本文取两原子的质心为格子坐标, 对 于推广的 LEPS 势 E, 用于两原子在簇合物表面的定位. 因此体系势函数 E 有 6 个变量,构成了 7 维能量超曲面. 超曲面上一阶导数为零的点称为临界点. 临界点的二阶 导数形成了6维 Hessian 矩阵. 同样本文用 Hessian 矩阵 负本征值的个数 λ 来表征态的临界性质. 对于 $\lambda=0$ 的临 界点对应着体系的稳定态,在此研究的目的是H原子表 面吸附态之间的相互作用, 所以只对 λ=0 的临界点进 行研究, 该临界点表示两个 H 原子都是吸附态. 如果两 个吸附位距离较远,吸附态之间的相互作用就很弱,则 两吸附态的性质变化就小,我们主要研究的是临界点性 质变化比较大的邻近吸附位之间相互作用的情况. 特别 是内层吸附态对邻近的表面吸附态之间相互作用的情 况最具有考察价值.

显然,5-MP 势以及由5-MP 势组装推广的 LEPS 势和 金属表面簇合物的结构密切相关,关键是如何调节5个 参数和两个 Sato 参数.通常用实验探测到的 H 原子在 W 低指数面上的实验数据拟合并优选5参数,使之重现吸 附原子在3个低指数面上的吸附性质.本体系优选的5参 数结果列于表1中.5参数确定的 H-W 表面吸附体系

5-MP势就具石	与了和表面簇合物结构无关的性质 ^[25~29] .	两
个 Sato 参数,	优化结果为 $\Delta_{H^-W} = -0.93, \Delta_{H^-H} = 0.08.$	

表1 H-W 表面体系 5-参数

Table 1 Five parameters for H-W system

体系	D/eV	β/nm^{-1}	R_0/nm	Q_1/nm	Q_2 /nm
H-W	1.94	2.05	1.75	0.09	0.26

2 计算结果和讨论

本文用 H-W 表面吸附体系 5-MP 势对 H-W 低指数面体系进行了系统研究,得到了全部临界点特性.计算结果列于表 2 中.其中, N 为 H 原子在临界点处与 W 原子的最近邻配位数目, *E*_b 为结合能, *f* 为 H 原子的表面正则振

动频率(f_/和 f₁分别为平行振动和垂直振动模式), R_{H-W}是 H原子与邻近配位W原子的键长, Z_{H-W}为氢原子距表面 高度.表3给出了本文结果与实验及其它理论结果的比 较.

2.1 H-W(100)体系

W(100)表面晶胞具有 *C*_{4ν} 局部点群对称性,对 H-W(100)体系势能超曲面扫描发现共存在四类不等价 临界点,分别与四类不等价吸附位对应.从表 2 计算结 果看,五重洞位 H、桥位 B、顶位 T 以及二层桥位 B'都 是 λ=0 的表面吸附态.五重洞位 H、桥位 B、顶位 T 这 三类吸附位都在(100)表面上,而二层桥位 B'(如图 1, 2 所示)是位于内表面的吸附位.从结合能比较来看,二层 桥位 B'的结合能 4.32 eV 最大,因此在低覆盖度下,H 原

表 2 氢-钨体系临界点性质 Table 2 Critical characteristics of H-W surface systems

H-W	II W	Ν	λ	E _b /eV –	<i>f</i> /meV		D = /(0.1 mm)	7 /(0.1)
	п-w				\perp	//	$\kappa_{\text{H-W}}(0.1 \text{ nm})$	$Z_{\text{H-W}}/(0.1 \text{ nm})$
H-W (100)	Β'	2	0	4.32	156	131, 251	$1.70 \times 2, 1.84 \times 2$	-0.95
	Н	5	0	2.67	171	20, 20	1.89, 2.25×4	0.32
	В	2	0	2.52	122	158, 34	1.83×2	0.93
	Т	1	0	2.08	259	15, 15	1.73	1.73
2H-W (100)	H(B')	5	0	2.62	153	51, 45	1.93, 2.05×2,	0.32
	B(B')	2	0	2.42	130	137, 39	2.49×2, 1.86×2	0.98
(110)	H_3	3	0	2.98	151	93, 68	1.88, 1.98×2	1.01
	LB	2	1	2.91	143	132	1.88×2	1.02
	SB	2	1	2.87	167	179	1.81×2	1.20
	Т	1	2	2.30	266		1.73	1.73
(111)	H_1	4	0	4.61	104	205, 288	1.70, 1.74, 1.78, 1.84	-1.42
	Β'	2	0	2.66	200	48, 122	1.81, 1.84	0.67
	Т	1	0	2.00	257	30, 31	1.74	1.74
	H ₃ '	3	1	3.04	343	77	1.61, 1.67, 2.67	-0.53
	H_2	4	2	2.47	255		1.75, 2.71×3	0.84
	H ₃	3	2	2.57	286		2.58×3	-0.11

表3 本文结果与文献值比较

 Table 3
 Comparison of this work and literatures

H-W	体系	实验结果	理论结果	本文
	(100) B	1.95 ^[8]	1.79 ^[10]	1.83
<i>R</i> /(0.1 nm)	(110) H ₃	2.09 ^[13]		1.88, 1.98×2
	(100) B	1.37 ^[8]		0.93
Z/(0.1 nm)	(110) H ₃	$1.25^{[13]}, 1.20 \pm 0.05^{[15]}$	$1.12^{[15]}, 1.12, 1.11, 1.09^{[20]}$	1.01
(//meV	(100)	\perp 155, 125, 250 ^[4,5] , 130 ^[6] , 118 ^[7]	97, 127 ^[10]	156, 151, 122, 130, 259
		// 55, 125 ^[4,5] , 80, 160 ^[6]		131, 251, 158, 53
	(110) H ₃	$\perp 155^{[16,17]}, 160^{[21]}$	154 ^[18,19]	151
		// 68, 95 ^[16,17] , 95 ^[21]	108, 81 ^[18,19]	93, 68

子会优先吸附在二层桥位 B'. H 原子吸附在 B'位获得了 156 meV 的 H-W 垂直振动频率, 平行振动频率为 131, 251 meV. 随着覆盖度的增加, H 原子会吸附在五重洞位 H(从配位键长来看,该位可以看作是具有单配位的2层 顶位),桥位 B 以及顶位 T 上,分别获得 171, 122, 259 meV 的垂直振动频率. 由于内层吸附态 B'的出现, 它将 会对表层吸附态的性质有所影响. 本文用 5-MP 势构造 推广的 LEPS 势研究了 2H-W(100)表面体系. 目的是研 究 H 原子表面吸附态之间的相互作用, 所以只对 $\lambda=0$ 的临界点进行研究.本文搜索了所有λ=0的临界点,并 将临界点性质变化明显的吸附态汇总于表 2 中. 其中, H(B')表示在二层桥位 B'态影响下最临近的五重洞位 H 吸附态, B(B')表示在二层桥位 B'态影响下最临近的桥位 B 吸附态. 结果表明, 只有与二层桥位 B'最邻近的五重 洞位 H 和桥位 B 临界性质变化较大. 临界性质变化的趋 势为结合能 Eb 下降, 吸附高度 Z 上升, 尤其是本征振动 变化明显. 五重洞位 H 的垂直振动频率由原来的 171 meV 降低到 153 meV; 平行振动频率由原来的 20, 20 meV 增加到 51,45 meV. 桥位 B 的垂直振动频率由原来 的 122 meV 变为 130 meV, 平行振动频率由原来的 158, 34 meV 变为 137, 39 meV.

从表 2 结果显示的配位键长来看, 二层桥位 B'是一 个畸变的四面体结构(如图 1,2 所示). 该吸附态具有 $C_{2\nu}$ 局部点群对称性,振动模式分析表明:理论获得的H原 子垂直表面的振动 156 meV 为全对称的 A1 不可约表示, 131 meV 为沿[001]晶轴方向平行表面的振动模式 B1不 可约表示, 251 meV 为沿[010]晶轴方向平行表面的振动 模式 B2不可约表示. 五重洞位 H 可以看作二层顶位, 它 与顶位 T 一样都具有 C4v 局部点群对称性. 因此计算所 得 171(H), 259 meV(T)是垂直表面振动模式属于全对称 的 A1 不可约表示, 19(H), 15(T) meV 平行表面的振动模 式为简并的2维E不可约表示. 五重洞位H因受到二层 桥位吸附的影响, 垂直振动由 171 meV 降到 153 meV, 属于全对称的A₁不可约表示,简并的E不可约表示因歧 变而退化, 劈裂成 51, 45 meV 两个一维不可约表示 Γ. 其中 51 meV 为沿[001]晶轴方向平行表面的振动模式, 45 meV 为沿[010]晶轴方向平行表面的振动模式. 桥位 吸附态具有 C2,局部点群对称性,振动模式分析表明: 正则振动 122 meV 对应着全对称的 A₁不可约表示, 正 则振动 158, 34 meV 对应着 B₁, B₂不可约表示, 二者皆 为平行表面振动. 前者沿[001]晶轴方向, 后者沿[010]晶 轴方向.

EELS^[4,5]损失谱图显示,在低覆盖度下对称谱图中 有 3 个峰, 155, 125, 250 meV,它们应该对应三个全对称 的垂直振动模式.与本文结果相对照,其中实验给出的

最强损失谱峰 155 meV 与二层桥位 B'及受 B'影响下的 五重洞位 H(B')的全对称垂直振动模式 156, 151 meV 非 常接近,因此本文将155 meV 的峰归结为 B'及 H(B')位 的垂直振动峰. Didham^[5]也认为 155 meV 的峰是一个宽 峰,可能包含有两种不同但互相交叠的吸附态.损失谱 峰 125 meV 与本文结果中 B 位及受 B'位影响的 B(B')位 的垂直振动频率 122, 130 meV 都非常接近,因此本文将 125 meV 的峰归结为 B 位及 B(B')的 H-W 垂直振动. Branes^[4]和 Didham 等^[5]都将 125 meV 的峰归结为 H 原 子在 B 位吸附的平行振动, 但由于这个峰出现在对称谱 图中,峰的强度也不弱,因此我们认为125 meV 这个峰 应为一垂直振动峰. Branes 等^[4]将 250 meV 的峰归结为 折光或三种基本模式共同作用的结果. 这个峰在对称谱 图中强度较弱, Branes 等^[4]未将它标示出来. 但我们认 为这个峰应为垂直振动峰. 它与本文结果中 T 位的垂直 振动频率 259 meV 非常接近,因此本文将 259 meV 的峰 归结为 T 位的 H-W 垂直振动.

在 EELS^[4,5]反对称谱图中出现了 4 个峰,峰值为 155,125,250,55 meV,我们将最低频 55 meV 归结为 H(B')位的平行振动.随着覆盖度增加,对称谱图中只出 现了一个峰,峰值为 130 meV,反对称谱图中仍有 4 个峰,分别为 250,160,130,80 meV. Branes 等^[4]将这些峰 解释为氢原子吸附在桥位,随着覆盖度的增加,垂直振 动频率由 155 减少为 130 meV,平行振动频率由 55,120 meV 增加为 80 和 160 meV.我们仔细观察了 EELS^[4]谱 图,从峰的走向看,我们认为三个峰的变化趋势分别为 由 55 meV 增加到 80 meV,对应于B 位及 B(B')位的 H-W 垂直振动;由 150 meV 增加到 160 meV,对应于二层桥 位 B'及五重洞位 H(B')的全对称垂直振动.

本文还预言了各个吸附态的平行振动模式,其中 B' 及 B(B')位的沿[001]方向的平行振动频率 131,137 meV 与 B'及 B(B')位的垂直振动频率比较接近,因此本文认 为在反对称图谱中峰值为 125 meV、随覆盖度增加移动 到 130 meV 的峰可能包含了这 4 个振动模式.B'的沿 [010]方向的平行振动频率 251 meV 与 T 位的垂直振动 频率 259 meV 接近,因此本文推测在反对称图谱中峰值 为 250 meV 的峰可能包含了这两个振动模式.剩余的几 个低频振动如 20,15,45 meV 在谱图中都未出现.我们 分析认为可能是由于这些峰值都太小所以被忽略了,或 者被当作声子振动处理了.本文还得到了各个吸附态的 其它临界点性质,与实验及理论所得结果基本一致(见 表 3).

2.2 H-W(110)体系

H-W(110)表面吸附体系是研究较多的一个体系.

本文通过理论计算获得了 H 原子在该表面吸附的全部临 界点性质. 该吸附体系的计算结果表明, 赝式三重位 H₃ 为 $\lambda=0$ 的表面吸附态, LB 和 SB 位都是 $\lambda=1$ 的表面扩散 过渡态, T 为 λ =2 的表面扩散极大点. Blenchet 等^[11,12]认 为H原子稳定吸附在桥位. Backx 等^[21]报道了氢吸附在 钨 110 和 111 面的顶位. 我们的计算结果支持了 Balden 等^[10,13~20]的观点,认为只有赝式三重位才是H原子的稳 定吸附位. 赝式三重位具有 2.98 eV 的吸附能, 与短桥 位(SB)及长桥位(LB)结合能 2.87, 2.91 eV 相差不大, 可 见H原子非常容易通过LB位和SB位在两相邻H3之间 扩散. Nordlander^[10]和 Altshuler^[18,19]也得到了相同的结 论. H 原子在表面上存在 H3-LB-H3, H3-SB-H3 式两种扩 散通道.为了直观地理解该吸附体系的势能面结构,本 文在距离表面 Z=0.09 nm 的高度扫描了 H 原子在表面 晶胞上的吸附扩散势能面,如图 2 所示. 该图生动直观 地展现了 H-W(110)吸附体系势能超曲面的结构. 下面 我们详细解析 H 原子的表面吸附态.



图 4 H 原子在 W (110)上的吸附扩散势能面 Figure 4 The PES contour of adsorption and diffusion of H atom on W(110) surface

赝式三重位具有 *C*_s 局部点群对称性, 计算获得的 151 meV (1224 cm⁻¹)为垂直表面的振动模式, 正则振动 93 meV (750 cm⁻¹)为沿[110] 晶轴方向平行表面的振动 模式, 68 meV (551 cm⁻¹)为沿[001] 沟槽方向平行表面的 振动模式. Balden 等^[16,17]在其 EELS 实验中出现的三个 峰分别为 546, 768, 1252 cm⁻¹. 与本文结果相对照, 我 们将最高频率的谱峰 1252 cm⁻¹指派为 H原子占据三重 位(H₃)产生的垂直表面的振动频率,将另外两个峰 546, 768 cm⁻¹指派为 H原子占据三重位的平行振动频率. 这 种指派与 Balden^[16,17]及 Altshuler^[18,19]的 CTC 理论结果相 一致. 与此同时,本文还得到了各吸附态的所有临界点 性质,并与实验及理论结果取得了一致(见表 3).

2.3 H-W(111)体系

比较而言, W(111)的单元晶胞较大, 利用实验手段对 该表面进行精确的结构分析较为困难. 因而对 H-W(111)

表面吸附体系的研究并不多,对于 H 原子在该表面的吸 附位,吸附高度、吸附键长以及振动频率等特性还不是很 清楚. 通过我们的模型,可预测实验尚未探测的信息. 从 表 2 来看,子表面吸附位 H₁,近桥位 B'和顶位 T 都为 λ=0的表面吸附态, 赝式三重位H₃'为λ=1的表面扩散过 渡态, H₂, H₃皆为氢原子表面扩散的峰点.

本文计算结果表明, 只有 H_1 位, 近桥位 B'和顶位 T 这三种吸附位是 $\lambda=0$ 的稳定吸附态. 比较结合能来看, 子表面吸附位 H_1 具有最大结合能, 因此在低覆盖度下 氢原子会优先吸附在 W(111)面的子表面吸附位 H_1 位, 相应的垂直振动频率为 104 meV, 平行振动频率为 205, 288 meV. 随着覆盖度增加, H 原子也会稳定吸附在近桥 位 B'及顶位 T, 相应的垂直振动频率分别为 200, 257 meV. 文中还得到了相关的临界点性质, 如吸附键长、吸 附高度、结合能等(见表 2). 由于赝式三重位 H_3 '为 $\lambda=1$ 的表面扩散过渡态, 因而当覆盖度增大到一定值时, H_3 ' 也可能被稳定占据. 实验^[22~24]上只预测了在 W(111)面 上存在 4 种稳定的 H 原子吸附态, 但没有给出这 4 种原 子吸附态的任何特征值. 考虑到文献[22~24]都是早期 的实验结果, 且都是主要研究氢分子在 W(111)表面的 吸附. 我们期望有近期的实验结果来验证本文结论.

3 结论

本文应用 5-MP 方法获得一组优选参数,比较确切地 描述了 H-W 表面之间的相互作用势,并以此考察了此类 体系的全部临界点特性.用由 5-MP 势组装推广的 LEPS 势方法研究了 2H-W(100)体系,考察了内层吸附位对与 其邻近的表层吸附位的临界点性质的影响.从理论方面, 对该类体系进行了全面而详细的研究.结果表明:

(1) 低覆盖度下, H 原子优先吸附在 W(100)面的内 层吸附位二层桥位 B', 获得 156 meV 的垂直振动频率, 随着覆盖度的增加, H 原子在五重洞位(二层顶位)、桥位 及顶位都是稳定吸附态.由于内层吸附位的优先吸附, 对与其邻近的表面吸附位的临界点性质造成了一定的 影响.发现二层桥位 B'对与其邻近的五重洞位 H(B')及 桥位 B(B')的影响比较大. H(B')位的垂直振动由171 meV 变为 153 meV; B(B')位的垂直振动由 122 meV 变为 130 meV.本文从理论上得到了实验 EELS^[4,5]损失谱图中所 有的峰,并对每个振动损失谱峰进行了合理的指派.

(2) 对于(110)面,本文的理论计算结果支持了 Balden 等^[10,13~20]的观点,三重位为 H 原子的稳定吸附 位,低覆盖度下将被优先稳定占据,垂直表面的振动频 率为 151 meV;平行表面的振动频率为 93,68 meV,与 实验结果^[16,17]一致. (3) 对于(111)面,本文结果显示子表面吸附位 H₁, 近桥位和顶位都是稳定吸附位,另外,由于赝式三重位 H₃'为 λ=1 的表面扩散过渡态,因而当覆盖度增大到一 定值时,H₃'也可能被稳定占据.同时本文还预测了H原 子在各个吸附位的临界点性质.如振动频率、结合能、 吸附键长、吸附高度等.

References

- Foritzheium, H.; Ibach, H.; Lehwald, S. Phys. Rev. Lett. 1976, 36, 1549.
- 2 Adnot, A.; Carette, J. D. Phys. Rev. Lett. 1977, 39, 209.
- 3 Tamm, P. W.; Schmidt, L. D. J. Chem. Phys. 1969, 51, 5352.
- 4 Branes, M. R.; Wills, R. F. Phys. Rev. Lett. 1978, 41, 1729.
- 5 Didham, E. F. J.; Allison, W.; Willis, R. F. Surf. Sci. 1983, 126, 219.
- 6 Ho, W.; Willis, R. F.; Plummer, E. W. Phys. Rev. Lett. 1978, 40, 1463.
- 7 Woods, J. P.; Erskine, J. L. J. Vac. Sci. Technol. A 1987, 5, 435.
- 8 Jaeger, R.; Menzel, D. Surf. Sci. 1980, 100, 561.
- 9 King, D. A.; Tohmas, G. Surf. Sci. 1980, 92, 201.
- Nordlander, P.; Holloway, S.; Norskov, J. K. Surf. Sci. 1984, 136, 59.
- 11 Blanchet, G. B.; Estrup, P. J.; Stiles, P. J. *Phys. Rev. B* **1981**, *23*, 3655.
- 12 Blanchet, G. B.; Dinardo, N. J.; Plummer, E. W. Surf. Sci. 1982, 118, 496.
- 13 Herlt, H. J.; Auer, E. B. Surf. Sci. 1986, 175, 336.
- 14 Chung, J. W.; Ying, S. C.; Estrup, P. J. Phys. Rev. Lett. 1986, 56, 749.
- Arnold, M.; Hupfauer, G.; Bayer, P.; Hammer, L.; Heinz,
 K.; Kohler, B.; Scheff, M. Surf. Sci. 1997, 382, 288.

- 16 Balden, M.; Lehwald, S.; Ibach, H.; Mills, D. L. Phys. Rev. Lett. 1994, 73, 854.
- Balden, M.; Lehwald, S.; Ibach, H. Phys. Rev. B 1996, 53, 7479.
- 18 Altshuler, E. S.; Mills, D. L. Surf. Sci. 1996, 367, L91.
- 19 Altshuler, E. S.; Mills, D. L.; Gerber, R. B. Surf. Sci. 1997, 374, 229.
- 20 Bend, K.; Paolo, R.; Matlhias, S. Phys. Rev. B 1997, 56, 13503.
- 21 Backx, C.; Feuerbacher, B.; Fitton, B.; Willis, R. F. *Phys. Lett. A* **1977**, *60*, 145.
- 22 Tamm, P. W.; Schmidt, L. D. J. Chem. Phys. 1971, 54, 4775.
- 23 Tamm, P. W.; Schmidt, L. D. J. Chem. Phys. 1971, 55, 4253.
- 24 Madey, T. E. Surf. Sci. 1972, 29, 571.
- 25 Wang, Z. X.; Hao, C.; Zhang, J. S.; Han, E. S.; Chen, Z. Q. Acta Chim. Sinica 1993, 51, 417 (in Chinese).
 (王泽新,郝策,张积树,韩恩山,陈宗淇,化学学报, 1993, 51, 417.)
- Zhang, J.; Diao, Z. Y.; Wang, Z. X.; Feng, H.; Hao, C. Acta Chim. Sinica 2005, 63, 1276 (in Chinese).
 (张静, 刁兆玉, 王泽新, 丰慧, 郝策, 化学学报, 2005, 63, 1276.)
- 27 Wang, Z. X.; Pang, X. H.; Zhang, X. M. Chem. J. Chin. Univ. 2004, 25, 705 (in Chinese).
 (王泽新, 庞雪辉, 张晓明, 高校化学学报, 2004, 25, 705.)
- Wang, Z. X.; Zhang, X. M.; Pang, X. H. Acta Chim. Sinica 2004, 62, 436 (in Chinese).

(王泽新, 张晓明, 庞雪辉, 化学学报, 2004, 62, 436.)

Feng, H.; Diao, Z. Y.; Wang, Z. X.; Zhang, J. Chem. J. Chin. Univ. 2006, 27, 297 (in Chinese).
(丰慧, 刁兆玉, 王泽新, 张静, 高等学校化学学报, 2006, 27, 297.)

(A0604259 YANG, X.; ZHENG, G. C.)